CCMicro : état des lieux des MEB et MET disponibles			27 novembre 2018
(CIRIMAT et Castaing)			

Appareil	Spécificités	Lieux	Responsables
MEB LEO 435VP	Source W, Vide P (< 400 Pa), EDS Imix PGT : détecteur Ge, refroidissement N2 liq	**ENSIACET**	D. Oquab, Y. Thebault
FEI Quanta450	Source W, pression contrôlée et mode environnemental (< 2600 Pa), EDS Quantax Bruker SDD 30mm²	**ENSIACET**	D. Oquab, Y. Thebault
MEB JEOL JSM6510LV	Source W, analyseur RX PGT Spirit, obligation maintenance N2liq	**UPS Chimie 2R1 Salle 1087 B**	J.-J. Demai
MEB JEOL JSM6400	Source W, analyseur RX Oxford Inca	**UPS Chimie Salle 17**	J.-J. Demai
Pulvérisateur cathodique Edward S150B	Métallisation Argent	**UPS Chimie Salle 17**	J.-J. Demai
Pulvérisateur cathodique JEOL JFC1200	Métallisation Argent	**UPS Chimie 2R1 Salle 1087 B**	J.-J. Demai
Pulvérisateur cathodique Cressington	Métallisation Argent, Or, Platine. Mesure des épaisseurs par quartz.	**UPS Chimie Salle 15**	M.-C. Barthelemy
MEB JEOL 7800F Prime	FEG cathode chaude, EDS SDD Oxford AZTEC, imagerie électronique à des résolutions sub-nanométriques ; microanalyse EDS/SDD ultra rapide et ultra fine	**UMS Castaing**	S. Le Blond Du Plouy - C. Josse
MEB JEOL 7100F TTLS-LV	FEG cathode chaude - LV (jusqu'à 300 Pa), EDS SDD - EBSD Oxford AZTEC - Channel 5, imagerie électronique haute résultion à basse tension - Observation et analyse d'échantillons isolants sans métallisation (mode basse pression), microanalyse EDS/SDD, analyse structurale via EBSD et EBSD en transmission (TKD)	**UMS Castaing**	C. Josse - A. Proietti
MEB JEOL 6700F	FEG cathode froide, EDS Si/LI PGT Spirit, imagerie électronique haute résolution; microanalyse EDS/SiLi	**UMS Castaing**	S. Le Blond du Pouy
MEB FEI HELIOS 600i FIB	Double colonne : FEG/FIB, EDS SDD Oxford instruments - EDS 3D, imagerie MEB et microanalyse EDS/SDD à haute résolution ; fabrication à l'échelle nanométrique de lames TEM ; imagerie et microanalyse en cross-section; imagerie et micro-analyse en 3D	**UMS Castaing**	C. Josse

MET JEM 1011	MET 100kV, Filament W, Résolution 4,5 Å, Imagerie de routine	**UMS Castaing**	A. Descamps Mandine - L. Weingarten
MET JEM 1400	MET 120kV, Filament W, Résolution 3,8 Å, Imagerie de routine	**UMS Castaing**	A. Descamps Mandine - L. Weingarten
MET JEM 2100F	MET 200kV, FEG Schottky, Résolution 2,3 Å pt / 1 Å ligne, TEM, STEM, EDX, Porte objet simple tilt, double tilt, cryo, environnemental, Appareil dédié Imagerie, analyse TEM et STEM, diffraction	**UMS Castaing**	A. Descamps Mandine - A. Pugliara - L. Weingarten
MET JEM ARM200F	MET 200kV COLD FEG Corrigé Sonde, Résolution TEM 1,9 Å pt / 1 Å ligne , Résolution STEM 0,78 Å,TEM, STEM Corrigé, EDX, EELS (EFTEM , STEM EELS), Porte objet simple tilt, double tilt, Appareil dédié à l'imagerie et l'analyse à l'échelle atomique en mode STEM	**UMS Castaing**	T. Hungria - A. Descamps Mandine